

УДК 548.737

*ПОСВЯЩАЕТСЯ 65-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА РАФАЭЛЯ ТАБАКЧИ*

**РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОКСАНОВ.  
III. СТРОЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ  
ТЕТРА- И ПЕНТАСИЛОКСАНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА АТОМАХ КРЕМНИЯ**

© 2007 С.Т. Малиновский<sup>1\*</sup>, А.Т. Валлина<sup>2</sup>, Е. Штокли-Еванс<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт химии АН РМ, Кишинев, Республика Молдова

<sup>2</sup>Институт химии Ньюшательского университета, Швейцария

Статья поступила 12 января 2006 г.

Методом рентгеноструктурного анализа изучено строение шести тетра- и одного пентасилоксанового соединений, отличающихся природой и местом расположения присоединенных к атому кремния органических (Me — метил, Ph — фенил, mPh — метоксифенил, 2mPh — диметоксифенил, 3mPh — триметоксифенил и C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>N — дипропилциан) заместителей. Проведен расчет зарядового состояния атомов в силоксановых молекулах и показано влияние кислородсодержащих радикалов на изменение длины связи Si—O и валентного угла Si—O—Si, влияющего на конфигурацию тетра- и пентасилоксановых фрагментов.

**Ключевые слова:** циклические силоксаны, органические заместители, межатомные расстояния, водородная связь.

**ВВЕДЕНИЕ**

Возможность использования силоксанов в качестве "строительных блоков" для получения высокомолекулярных кремнийорганических полимерных соединений, привлекающих внимание своими уникальными физико-химическими свойствами (термоокислительной, ультрафиолетовой, радиационной стабильностью, различной температурой плавления, негорючестью), во многом зависит от строения и конфигурации их макромолекул [1]. Проведенные ранее исследования силоксанов показали возможность образования как "открытых", так и "циклических" типов структур, содержащих в своем составе (3—5) повторяющихся SiO единиц, отличающихся различными органическими заместителями на атомах кремния [2—29]. Сравнение основных характеристик изученных ранее силоксанов, к которым можно отнести длину связи Si—O, валентный угол Si—O—Si и, как следствие последнего, конфигурацию силоксанового острова, указывают на их заметное отличие друг от друга. Так, например, в простейших "коротких" линейных силоксанах, к которым можно отнести гексаметилдисилоксан [2, 3], длины связи Si—O равны 1,626 и 1,634 Å, валентный угол Si—O—Si составляет 148,2°. В соединении тетраметилдисилоксандиола [4, 5] величина связи Si—O практически не отличается от 1,624, 1,631 Å [2, 3], в то время как в диольных фрагментах этой структуры межатомное расстояние Si—OH увеличивается до 1,644 Å, при этом валентный угол Si—O—Si уменьшается до 141,4°. Было показано, что с увеличением числа единиц SiO, в соединениях трисилоксан-1,5-диолов, в зависимости от величины и природы присоединенных к атому кремния органических замес-

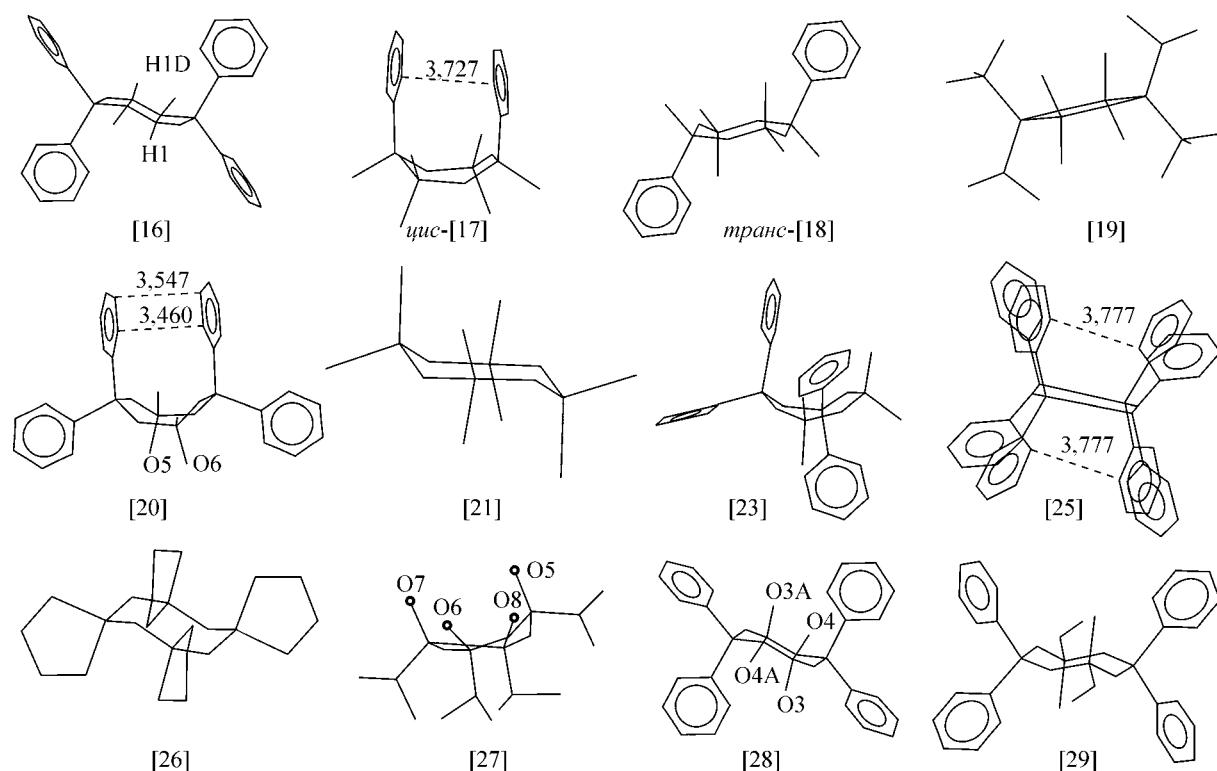
\* E-mail: stanis@dnt.md

тителей, наблюдается образование двух типов "открытых" структур, отличающихся друг от друга различными расстояниями между атомами кислорода диольных фрагментов. С одной стороны (тип 1), эти расстояния находятся в пределах 2,737(3)–2,805(3) Å, с возможной реализацией между ними внутримолекулярной водородной связи O—H...O 2,737(2) Å [5, 6]. С другой стороны (тип 2), эти расстояния колеблются в пределах от 4,133(2) до 5,187(2) Å, при этом связь Si—O может укорачиваться до 1,594(4) Å, а валентный угол Si—O—Si — увеличиваться до 174,7(3)°.

Исследования циклических трисилоксанов [7—14], содержащих в своем составе различную комбинацию присоединенных к атому кремния органических радикалов <sup>1</sup>Bu, Me, Ph, *p*-Tol, находящихся в различных положениях цикла  $\text{Si}_3\text{O}_3$ , указывают на их неоднозначное влияние на значение связи Si—O, величина которой колеблется в пределах 1,625—1,665 Å.

Большая гибкость угла Si—O—Si позволяет объяснить некоторые особенности конфигурации циклических фрагментов. Шестичленные углеродсодержащие трисилоксановые циклы за счет заниженных значений (125—135°) углов Si—O—Si по сравнению с линейными силоксанами — почти плоские и проявляют тенденцию к конформации *полукресла*. Использование в трисилоксановых молекулах стерически более емких диметокси- и trimetoxифенильных заместителей в отдельных случаях приводит к существенному изменению величины связи кремний—кислород, значение которой, например в соединении 1,5-дитриметоксифенил-1,3,5-триметил-3-фенил-трицикlosилоксана (триметоксифенильные радикалы расположены в *цис*-положении), уменьшается до 1,607(5) Å, что не является характерным для изученных ранее трисилоксановых соединений (см. часть II) [15].

С увеличением числа звеньев до восьми  $\text{Si}_4\text{O}_4$  с различной комбинацией органических заместителей (H, OH, Me, Ph, <sup>1</sup>Bu, <sup>1</sup>Pr) на атомах кремния (структурная схема 1), приводит к заметному (по сравнению с циклами  $\text{Si}_3\text{O}_3$ ) увеличению углов Si—O—Si от 139,3 до 164,2° [16—29]. Значения этих углов не допускают образования плоского цикла, он оказывается складчатым, и, как было показано в [23], может приобретать различные конформации: *седла*, *баны*, *кресла*, *короны*, для каждой из которых возможны свои точечные группы симметрии (схема 2).



Структурная схема 1



Схема 2

При этом в зависимости от природы углеродсодержащего заместителя на атоме кремния длина связи Si—O изменяется от 1,574 до 1,639 Å. На структурной схеме 1 атомы водорода для удобства не приведены.

С целью выяснения влияния органических заместителей различной стерической и химической природы на атомах кремния на изменение длины связи Si—O и валентного угла Si—O—Si, ответственного за конфигурацию циклического фрагмента  $\text{Si}_4\text{O}_4$ , нами было предпринято рентгеноструктурное исследование шести тетрасилоксановых соединений I—VI:

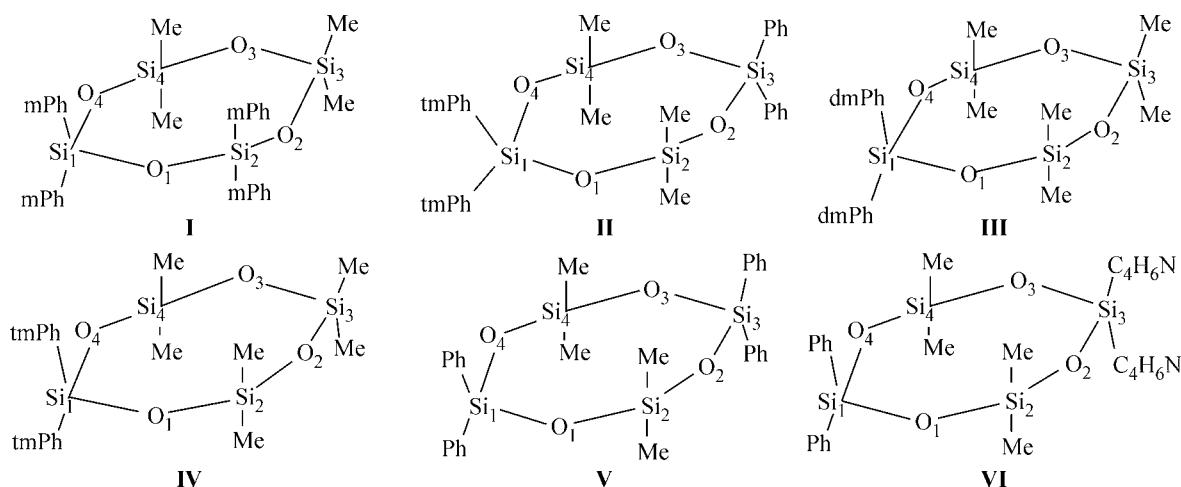


Схема 3

1,1,2,2-тетраметоксифенил-3,3,4,4-тетраметилтетрасилоксан (I), 1,1-дитриметокси-2,2,4,4-тетраметил-3,3-дифенилтетрасилоксан (II), 1,1-диэтилметоксифенил-2,2,3,3,4,4-гексаметилтетрасилоксан (III), 1,1-дитриметоксифенил-2,2,3,3,4,4-гексаметилтетрасилоксан (IV), 1,1,3,3-тетрафенил-2,2,4,4-тетраметилтетрасилоксан (V), 1,1-дифенил-2,2,4,4-тетраметил-3,3-дипропилцианаттетрасилоксан (VI) (схема 3). В литературе отсутствовали данные по строению и конфигурации дискретных циклических пентасилоксановых молекул  $\text{Si}_5\text{O}_5$ . Поэтому нами было исследовано строение соединения 1,1-дитриметокси-2,2,3,3,4,4,5,5-октаметилпентасилоксан (VII).

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рентгеноструктурный эксперимент проведен на автоматическом дифрактометре Stoe Mark II ( $\text{MoK}_{\alpha}$ -излучение). Структуры расшифрованы и уточнены прямым методом в рамках программ SHELLS-97 и SHELLXL-97 [10]. Положение неводородных атомов уточняли в полноматричном анизотропном приближении, атомы водорода локализованы из разностных Фурье-синтезов, частично фиксированы  $U_{\text{iso}} = 1,5(U_{\text{eq}} - \text{O-атом}) \text{ \AA}^2$ . Основные кристаллографические данные и характеристики эксперимента приведены в табл. 1.

### ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Строение независимых молекул I—VII представлено на рисунке. Тетрагональная координация атома кремния  $2\text{O}_2\text{C}$  образована двумя атомами О силоксанового цикла и двумя атомами углерода, принадлежащими метильным (Me), фенильным (Ph), метоксифенильным (mPh), ди-метоксифенильным (2mPh) или триметоксифенильным (3mPh) радикалам. Межатомные расстояния Si—C заметно отличаются друг от друга. Так, например, в соединении I длина связи

Т а б л и ц а 1

Основные кристаллографические данные, характеристики эксперимента и уточнения структур I—VII

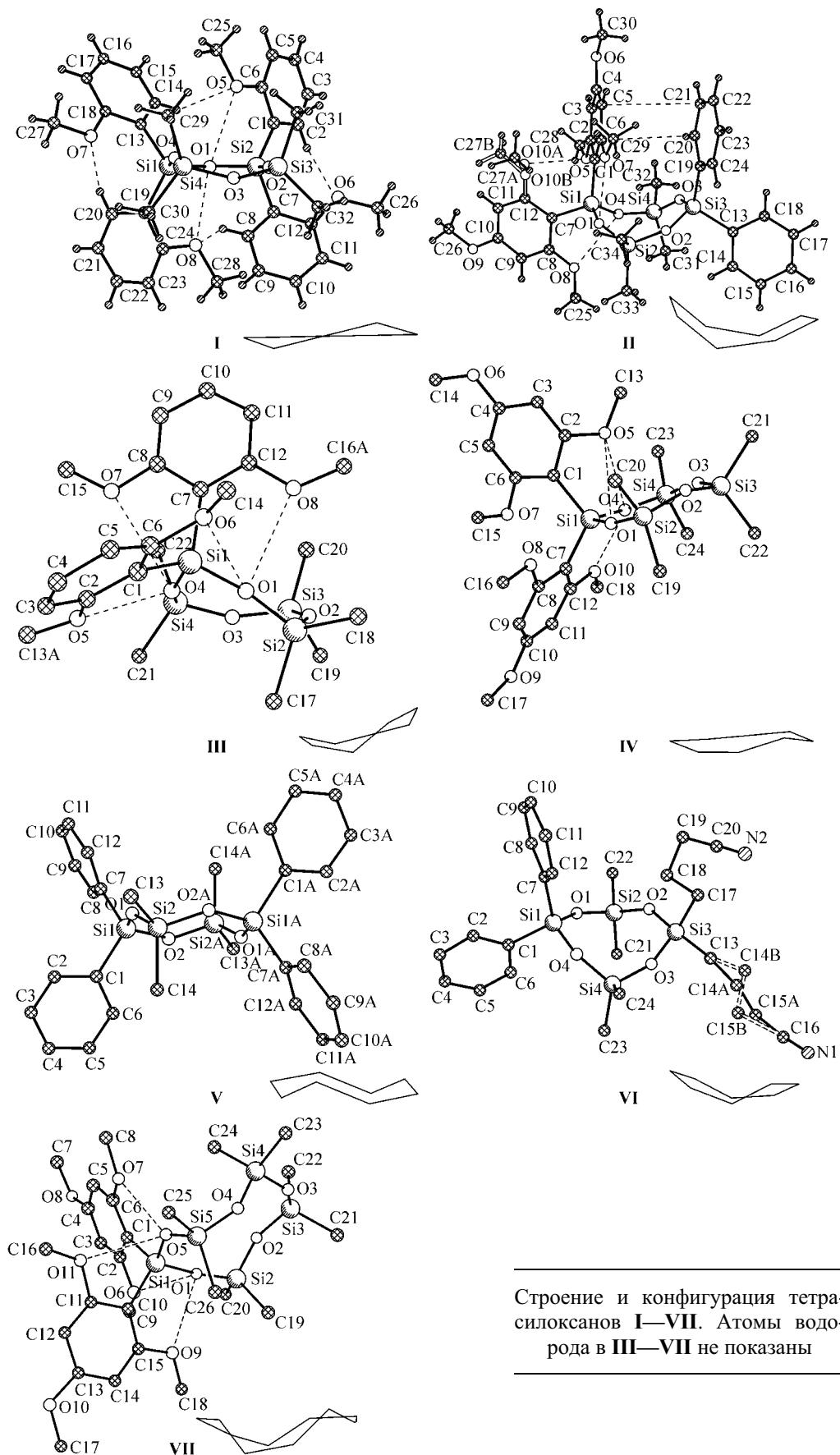
Соединение	I	II
Эмпирическая формула	C <sub>32</sub> H <sub>40</sub> O <sub>8</sub> Si <sub>4</sub>	C <sub>34</sub> H <sub>44</sub> O <sub>10</sub> Si <sub>4</sub>
Молекулярная масса	665,00	725,05
Температура, К	223(2)	223(2)
Длина волны	0,71073	0,71073
Сингония, пр. группа	Моноклинная, P2 <sub>1</sub> /n	Моноклинная, P2 <sub>1</sub> /c
a, b, c, Å	15,083(2), 11,755(1), 21,273(3)	10,670(2), 9,487(2), 37,291(5)
α, β, γ, град.	90, 107,28(1), 90	90, 96,88(2), 90
V, Å <sup>3</sup>	3601,4(7)	3747,5(1)
Z, ρ(выч.) г/см <sup>3</sup>	4, 1,226	4, 1,285
Размеры кристалла, мм	0,65×0,50×0,35	0,76×0,76×0,76
Коэф. абсорбции, мм <sup>-1</sup>	0,210	0,212
Диапазон θ, град.	2,00—25,88	2,10—25,48
F(000)	1408	1536
Интервал индексов	-18<h<18, -14<k<14, -25<l<26	-12<h<12, 0<k<11, 0<l<45
Число наблюдаемых рефлексов	6941	6956
Число уточняемых параметров	405	472
GOOF по F <sup>2</sup> (S)	0,953	1,145
R-фактор [I>4σ(I)]	R1 = 0,0660, wR2 = 0,1397	R1 = 0,0688, wR2 = 0,1356
R-фактор (по всему массиву)	R1 = 0,0927, wR2 = 0,1502	R1 = 0,1179, wR2 = 0,1706
Соединение	III	IV
Эмпирическая формула	C <sub>22</sub> H <sub>36</sub> O <sub>8</sub> Si <sub>4</sub>	C <sub>24</sub> H <sub>40</sub> O <sub>10</sub> Si <sub>4</sub>
Молекулярная масса	540,87	600,92
Температура, К	223(2)	293(2)
Длина волны	0,71073	0,71073
Сингония, пр. группа	Триклиническая, P -1	Ромбическая, P bca
a, b, c, Å	8,788(1), 10,457(1), 17,717(1)	8,975(1), 22,198(1), 32,631(2)
α, β, γ, град.	102,25(1), 96,89(1), 103,43(1)	90, 90, 90
V, Å <sup>3</sup>	1522,9(2)	6501,0
Z, ρ(выч.) г/см <sup>3</sup>	2, 1,180	8, 1,228
Размеры кристалла, мм	0,76×0,57×0,34	0,72×0,46×0,15
Коэф. абсорбции, мм <sup>-1</sup>	0,233	0,230
Диапазон θ, град.	2,07—25,48	1,83—24,98
F(000)	576	2560
Интервал индексов	-10<h<10, -12<k<12, 0<l<21	0<h<10, 0<k<26, 0<l<38
Число наблюдаемых рефлексов	5650	5709
Число уточняемых параметров	337	356
GOOF по F <sup>2</sup> (S)	1,068	0,810
R-фактор [I>4σ(I)]	R1 = 0,0589, wR2 = 0,1351	R1 = 0,0603, wR2 = 0,0596
R-фактор (по всему массиву)	R1 = 0,0785, wR2 = 0,1509	R1 = 0,2428, wR2 = 0,0853
Соединение	V	VI
1	2	3
Эмпирическая формула	C <sub>28</sub> H <sub>32</sub> O <sub>4</sub> Si <sub>4</sub>	C <sub>24</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub> Si <sub>4</sub>
Молекулярная масса	544,90	526,89

Окончание табл. 1

1	2	3
Temperatura, K	293(2)	293(2)
Dлина волны	0,71073	0,71073
Сингония, пр. группа	Триклинная, <i>P</i> -1	Триклинная, <i>P</i> -1
<i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> , Å	9,221(1), 9,335(1), 10,083(2)	9,383(1), 9,586(1), 18,326(1)
$\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ , град.	69,37(6), 77,79(7), 68,47(1)	76,07(1), 84,21(2), 76,63(1)
<i>V</i> , Å <sup>3</sup>	752,2(2)	1479,2(2)
<i>Z</i> , $\rho$ (выч.) г/см <sup>3</sup>	2, 2,406	2, 1,183
Размеры кристалла, мм	0,40×0,42×0,34	0,68×0,38×0,15
Коэф. абсорбции, мм <sup>-1</sup>	0,455	0,231
Диапазон $\theta$ , град.	2,17—25,48	2,29—25,50
<i>F</i> (000)	576	560
Интервал индексов	-10< <i>h</i> <11, -10< <i>k</i> <11, 0< <i>l</i> <12	-11< <i>h</i> <11, -11< <i>k</i> <11, 0< <i>l</i> <22
Число наблюдаемых рефлексов	2805	5506
Число уточняемых параметров	166	330
GOOF по <i>F</i> <sup>2</sup> ( <i>S</i> )	1,082	1,098
<i>R</i> -фактор [ <i>I</i> >4σ( <i>I</i> )]	<i>R</i> 1 = 0,0391, <i>wR</i> 2 = 0,0963	<i>R</i> 1 = 0,0573, <i>wR</i> 2 = 0,1142
<i>R</i> -фактор (по всему массиву)	<i>R</i> 1 = 0,0504, <i>wR</i> 2 = 0,1044	<i>R</i> 1 = 0,0834, <i>wR</i> 2 = 0,1316
Соединение	VII	
Эмпирическая формула	<chem>C24H34N2O4Si4</chem>	
Молекулярная масса	675,08	
Temperatura, K	223(2)	
Dлина волны	0,71073	
Сингония, пр. группа	Триклинная, <i>P</i> -1	
<i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> , Å	9,954(1), 12,520(1), 15,032(1)	
$\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ , град.	106,88(1), 95,79(1), 93,96(1)	
<i>V</i> , Å <sup>3</sup>	1773,9(2)	
<i>Z</i> , $\rho$ (выч.) г/см <sup>3</sup>	2, 1,264	
Размеры кристалла, мм	0,40×0,30×0,08	
Коэф. абсорбции, мм <sup>-1</sup>	0,252	
Диапазон $\theta$ , град.	2,36—25,86	
<i>F</i> (000)	720	
Интервал индексов	11< <i>h</i> <11, -15< <i>k</i> <15, -18< <i>l</i> <18	
Число наблюдаемых рефлексов	13970 / 6404 [ <i>R</i> (int) = 0,0576]	
Число уточняемых параметров	379	
GOOF по <i>F</i> <sup>2</sup> ( <i>S</i> )	0,855	
<i>R</i> -фактор [ <i>I</i> >4σ( <i>I</i> )]	<i>R</i> 1 = 0,0411, <i>wR</i> 2 = 0,0910	
<i>R</i> -фактор (по всему массиву)	<i>R</i> 1 = 0,0775, <i>wR</i> 2 = 0,0987	

Si—C<sub>mPh</sub> колеблется в пределах от 1,854(3) до 1,863(3) Å, в то время как Si—C<sub>Me</sub> — в пределах 1,824(5)—1,848(7) Å, значения тетраэдрических углов при атоме Si находятся в пределах от 106,0(1) до 114,4(1)<sup>o</sup>, что хорошо согласуется с данными, приведенными в [ 16—29 ]. В соединении III длина связи Si—C<sub>2mPh</sub> достигает величины 1,880(3) Å.

Как было отмечено ранее, основными геометрическими параметрами силоксанов являются валентные углы Si—O—Si и межатомные расстояния Si—O. В зависимости от природы и количества присоединенных к атому кремния органических заместителей в исследованных I—VI



Строение и конфигурация тетрасилоксанов I—VII. Атомы водорода в III—VII не показаны

Т а б л и ц а 2

Основные расстояния ( $\text{\AA}$ ) и валентные углы (град.) в I—VI

Связь / угол	I	II	III	IV	V	VI
Si(1)—O(1)	1,629(2)	1,621(3)	1,617(2)	1,603(3)	1,626(1)	1,617(3)
Si(1)—O(2)	—	—	—	—	1,624(1)	—
Si(1)—O(4)	1,608(2)	1,621(3)	1,610(2)	1,609(3)	—	1,618(2)
Si(2)—O(1)	1,627(2)	1,621(3)	1,602(2)	1,601(3)	1,631(2)	1,621(2)
Si(2)—O(2)	1,610(2)	1,626(3)	1,616(3)	1,627(3)	—	1,625(2)
Si(2)—O(2) <sup>#1</sup>	—	—	—	—	1,629(1)	—
Si(3)—O(2)	1,581(2)	1,615(3)	1,607(3)	1,615(3)	—	1,625(2)
Si(3)—O(3)	1,636(2)	1,623(3)	1,604(3)	1,597(4)	—	1,613(3)
Si(4)—O(4)	1,611(2)	1,609(3)	1,597(2)	1,598(3)	—	1,618(2)
Si(4)—O(3)	1,631(2)	1,626(3)	1,619(3)	1,606(4)	—	1,613(3)
O(1)—Si(1)—O(2)	—	—	—	—	110,6(1)	—
O(1)—Si(1)—O(4)	110,8(1)	108,4(2)	106,7(1)	107,8(2)	—	111,0(1)
O(1)—Si(2)—O(2)	110,4(1)	110,8(2)	110,6(1)	109,7(2)	—	109,0(1)
O(1)—Si(2)—O(2) <sup>#1</sup>	—	—	—	—	107,7(1)	—
O(2)—Si(3)—O(3)	108,7(1)	110,6(2)	111,5(2)	111,4(2)	—	109,7(1)
O(4)—Si(4)—O(3)	109,1(1)	109,5(2)	109,2(1)	111,5(2)	—	108,2(1)
Si(1)—O(1)—Si(2)	141,3(1)	144,0(2)	147,4(2)	161,9(2)	—	151,1(2)
Si(1)—O(2)—Si(2) <sup>#1</sup>	—	—	—	—	142,9(1)	—
Si(3)—O(2)—Si(2)	175,1(1)	157,7(2)	149,5(2)	146,9(2)	—	143,9(2)
Si(3)—O(3)—Si(4)	138,3(2)	142,8(2)	149,0(2)	155,3(3)	—	158,1(2)
Si(4)—O(4)—Si(1)	162,2(1)	148,9(2)	154,8(2)	156,4(2)	—	154,4(2)

П р и м е ч а н и е. Элемент преобразования симметрии  ${}^{\#1} -x, -y, -z+1$ .

тетрасилоксановых циклах величины межатомных расстояний Si—O и валентных углов Si—O—Si лежат в интервале 1,581(2)–1,631(2)  $\text{\AA}$  и 138,3(1)–175,1(1) $^{\circ}$  (табл. 2). Наибольшее увеличение валентного угла Si—O—Si до 175,1(1) $^{\circ}$  и укорачивание связи Si—O до 1,581(2)  $\text{\AA}$  наблюдается в соединении I. В этом случае к двум смежным атомам кремния, находящимся в положениях 1 и 2 тетрасилоксанового цикла, присоединено максимальное количество стерически емких кислородсодержащих dmPh радикалов, остальные атомы Si заняты диметильными группами. Квантовохимический расчет для I—VI в рамках программы GAUSSIAN-98w [ 30 ], как и в случае исследования трисилоксановых соединений [ 15 ] (часть II), показал увеличение заряда до 1,53 ат. ед. на атомах кремния с кислородсодержащими радикалами по сравнению с зарядом 1,39 ат. ед. в случае присутствия углеродсодержащих заместителей. Вероятно, изменение зарядового состояния атома кремния не может не сказаться на распределении электронной плотности в силоксановом цикле, которое приводит к некоторому изменению расстояний и валентных углов. Очевидно, как и в случае исследования трисилоксановых молекул [ 15 ], можно предположить, что укорачивание связи Si2—O2 до 1,581(2)  $\text{\AA}$  связано с повышением ее кратности за счет  $\pi$ -составляющей, возникающей в результате акцептирования одной из неподеленных пар кислорода со свободными 3d-орбиталами кремния за счет  $d_{\pi}(\text{Si})—p_{\pi}(\text{O})$ -взаимодействия, однако при этом нельзя не учитывать внутримолекулярные и невалентные взаимодействия, возникающие в тетрасилоксановых молекулах.

В I на двух смежных атомах кремния Si1 и Si2 четыре mPh радикала расположены попарно в *цис*-положении относительно плоскости тетрасилоксанового цикла. Диэдральный угол, образованный метоксифенильными заместителями, находящимися в *цис*-положении, равен 67,9(1) и 77,7(1) $^{\circ}$ . Это является следствием внутримолекулярных взаимодействий типа C—H...O, возникающих между смежными mPh радикалами C2—H2...O6, C8—H8...O8, C14—H14...O5

Таблица 3

Отклонения атомов ( $\text{\AA}$ ) в I—VI от среднеквадратичной плоскости, образованной атомами кремния

Атомы	I	II	III	IV	V	VI
Si(1)*	0,005(1)	0,473(1)	0,399(1)	-0,031(1)	0	-0,400(1)
Si(2)*	-0,005(1)	-0,461(1)	-0,402(1)	0,031(1)	0	0,410(1)
Si(3)*	0,005(1)	0,461(1)	0,400(1)	-0,032(1)	0	-0,405(1)
Si(4)*	-0,005(1)	-0,474(1)	-0,397(1)	0,031(1)	0	0,396(1)
O(1)	0,014(2)	0,111(3)	0,078(2)	0,127(3)	0,363(1)	0,043(3)
O(2)	-0,248(2)	-0,325(3)	0,200(3)	-0,326(4)	-1,609(2)	-0,367(3)
O(3)	0,348(3)	0,324(4)	-0,241(3)	-0,190(4)	0,363(1)	0,104(3)
O(4)	0,028(2)	-0,128(4)	-0,269(2)	0,109(4)	-1,609(2)	-0,127(3)

и C20—H20...O7, длина водородных связей 3,372(3), 3,240(2), 3,433(3) и 3,461  $\text{\AA}$ . Кроме того, реализуется внутримолекулярная H-связь между атомом углерода mPh радикала и атомом кислорода силоксанового цикла C13—H13...O4 3,469(5)  $\text{\AA}$  (расстояние H13...O4 2,76  $\text{\AA}$ , угол при атоме водорода 130,1°). В структуре наблюдается отталкивание между атомами кислорода метоксифенильной группы и атомом кислорода тетрасилоксанового цикла, расстояния O1...O8 и O1...O5 равны 3,092(2) и 3,022(2)  $\text{\AA}$  соответственно. По всей видимости, суммарный эффект вышеописанных взаимодействий оказывает существенное влияние на конфигурацию силоксанового цикла, длину связи Si—O и величину валентного угла Si—O—Si. Необходимо отметить, что внутримолекулярные отталкивания типа O...O наблюдаются и в II—IV, содержащих в своем составе заместители 2mPh и 3mPh на атоме кремния. При этом расстояния O...O лежат в пределах 2,797(2)—3,013(3)  $\text{\AA}$ .

В структурно изученных тетрасилоксановых соединениях I—VI наибольший интерес представляет конфигурация восьмичленного цикла  $\text{Si}_4\text{O}_4$ , которая находится в прямой зависимости от величины углов Si—O—Si. Интервал колебаний последних значительно выше, чем в трисилоксанах, и составляет 141,3(1)—175,1(1)°.

Сильно отличающиеся значения эндоциклических углов при атомах кислорода в силоксановых циклах во многом зависят от взаимодействий, осуществляемых между валентно не связанными радикалами и вкладом дополнительного взаимодействия с участием  $d$ -электронов атомов Si силоксановых I—VII циклов. Четыре атома кремния в I находятся практически в одной плоскости с расстоянием атомов кислорода O1, O2, O3 и O4 от плоскости  $\text{Si}_4$  на величины соответственно равные 0,014(2), -0,248(2), 0,348(2) и -0,128(4)  $\text{\AA}$ , в результате конформация тетрасилоксанового цикла может быть описана как *плоское кресло* с симметрией  $C_{2h}$ . В II четыре атома Si образуют уплощенный тетраэдр, выход последних из образованной ими среднеквадратичной плоскости  $\text{Si}_4$  составляет 0,437(1), -0,461(1), 0,461(1) и -0,474(1)  $\text{\AA}$  (табл. 3), расстояния Si—Si находятся в пределах 3,080(3)—3,179(3)  $\text{\AA}$ , в этом случае конформация цикла "ваннообразна" с симметрией  $S_4$ . Аналогичная конфигурация силоксанового цикла наблюдается в соединении III. Использование в качестве заместителей на атоме Si3 дипропилцианового радикала в VI, как и во всех выше описываемых структурах, не приводит к образованию межмолекулярных взаимодействий, не превышающих суммы ван-дер-ваальсовых радиусов, конформация силоксанового цикла "ваннообразна" и не отличается от наблюданной в II и III. В центросимметричной молекуле V все атомы Si лежат в одной плоскости, выход атомов кислорода из этой плоскости составляет 0,363(1) и -1,609(2)  $\text{\AA}$  (см. табл. 3). Конформация цикла приобретает "креслообразную" форму с точечной симметрией  $S_2$ .

В структурно исследованном десятичленном силоксановом соединении 1,1-дитриметокси-2,2,3,3,4,4,5,5-октаметилпентасилоксан VII (количество единиц  $\text{SiO}$  равно 5) конформация циклического фрагмента  $\text{Si}_5\text{O}_5$  существенно отличается от конформаций три- и тетрасилоксановых соединений. Выход атомов кремния из среднеквадратичной плоскости  $\text{Si}_5$  составляет 0,699(1), -0,456(1), 0,070(1), 0,363(1) и -0,676(1)  $\text{\AA}$ , с чередованием торсионных углов Si—O—Si—O и O—Si—O—Si -78,6(9), 30,7(9), 109,9(3), -75,6(3), -41,1(3), 90,3(3), -117,4(7), 27,2(4), 100,2(2)

и  $-50,1(2)^\circ$ . Результат такого чередования показывает, что десятичленный силоксановый цикл менее напряжен и его конформация может быть описана как "твистованная". Используя терминологию "действительных" и "мнимых" углов, предложенную Дейлом для описания макроциклических соединений [31], такую конформацию, очевидно, еще можно описать как [4 6]. Значения расстояний Si—O и эндоциклических углов Si—O—Si ( $1,594(2)$ — $1,627(3)$  Å и  $137,6(1)$ — $171,0(1)^\circ$  соответственно) мало отличаются от подобных величин, найденных в тетрасилоксановых молекулах I—VI. При этом наибольшее значение валентного угла Si1—O1—Si2 ( $171,0(1)^\circ$ ) относится к атому кислорода, находящемуся рядом с атомом Si1, к которому присоединены два триметоксифенильных радикала. Аналогично I—VI атомы кислорода радикалов 3mPh в VII участвуют в образовании отталкивающего взаимодействия с атомами кислорода силоксанового цикла O1...O6 2,990(3), O1...O9 2,862(3), O5...O7 2,876(3) и O5...O11 2,923(3) Å, оказывая существенное влияние на его конфигурацию.

Авторы выражают свою благодарность профессору Рафаэлю Табакчи (Raphael Tabacchi) и его сотрудникам из Ньюшательского Университета за предоставленные для структурного исследования соединения.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lukevich E., Pudova O., Sturkovich R. // Molecular Structure of Organosilicons. – 1989. Ellis. Horwood. Chichester. UK. Ch. 3. – P. 175 – 190.
2. Barrow M.J., Ebsworth E.A., Harding M.M. // Acta Crystallogr. Sect. B. – 1979. – **35**. – P. 2093 – 2099.
3. Чернега А. Н., Антипин М.Ю., Стручков Ю.Т. и др. // Укр. хим. журн. – 1993. – **59**. – С. 196 – 202.
4. Lickiss P.D., Redhouse A.D., Tomplison R.J. et al. // J. Organomet. Chem. – 1993. – **453**. – P. 13 – 19.
5. Graalmann O., Klingebiel U., Clegg W., Sheldrick G.M. // Chem. Ber. – 1984. – **117**. – P. 2988 – 2997.
6. Малиновский С.Т., Валлина А.Т., Штокли-Эванс Е. // Журн. структур. химии. – 2006. – **47**. – С. 1137 – 1142.
7. Clegg W. // Acta Crystallogr., Sect. B. – 1982. – **38**. – P. 1648 – 1652.
8. Шкловер В.Е., Бокий Н.Г., Стручков Ю.Т. и др. // Журн. структур. химии. – 1974. – **15**. – С. 841 – 849.
9. Бокий Н.Г., Захарова Г.Н., Стручков Ю.Т. // Там же. – 1972. – **13**. – Р. 291 – 297.
10. Tomlins P.E., Ludon J.E., Akriigg D., Sheldrik B. // Acta Crystallogr., Sect. C. – 1985. – **41**. – Р. 292 – 298.
11. Овчинников Ю.Э., Стручков Ю.Т., Бузин М.И., Папков В.С. // Высокомол. соединения. Серия А. – 1997. – **39**. – С. 430 – 437.
12. Овчинников Ю.Э., Шкловер В.Е., Стручков Ю.Т. и др. // Металлоорган. химия. – 1988. – **1**. – С. 1126 – 1135.
13. Шкловер В.Е., Бокий Н.Г., Стручков Ю.Т. и др. // Журн. структур. химии. – 1974. – **15**. – Р. 90 – 98.
14. Schmidt-Base D., Kingebeil U. // Chem. Ber. – **123**. – Р. 449 – 453.
15. Малиновский С.Т., Валлина А.Т., Штокли-Эванс Е. // Журн. структур. химии. – 2006. – **47**. – С. 1143 – 1149.
16. Ovchinnikov Yu.E., Shklover V.E., Struchkov Yu.T. et al. // Z. Anorg. Allg. Chem. – 1985. – **524**. – P. 75 – 81.
17. Caristrom D., Falkenberg G. // Acta Chem. Scand. – 1973. – **27**. – P. 1203 – 1210.
18. Soderholm M., Caristrom D. // Acta Chem. Scand. B. – 1977. – **31**. – P. 193 – 199.
19. Egert E., Haase M., Klingebiel U. et al. // J. Organomet. Chem. – 1986. – **315**. – P. 19 – 26.
20. Шкловер В.Е., Дубчак И.Л., Стручков Ю.Т. и др. // Журн. структур. химии. – 1981. – **22**. – С. 99 – 103.
21. Steinfink H., Post B., Fankuchen I. // Acta Crystallogr. – 1955. – **8**. – P. 420 – 428.
22. Wendler C., Reinke H., Kelling H. // J. Organomet. Chem. – 2001. – **626**. – P. 53 – 60.
23. Шкловер В.Е., Капинин А. Е., Гусев А.И. и др. // Журн. структур. химии. – 1973. – **14**. – С. 692 – 699.
24. Unno M., Takada K., Matsumoto H. // Chem. Lett. – 1998. – Р. 489 – 496.
25. Овчинников Ю.Е., Шкловер В.Е., Стручков Ю.Т. и др. // Металлоорг. химия. – **1**. – С. 1117 – 1120.
26. Hensen K., Gebhardt F., Kettner M. et al. // Acta Crystallogr. Sect. C. – 1997. – **53**. – P. 1867 – 1875.
27. Unno M., Takada K., Matsumoto H. // Chem. Lett. – 2000. – Р. 242 – 248.
28. Шкловер В.Е., Дубчак И. Л., Стручков Ю.Т. и др. // Журн. структур. химии. – 1981. – **22**. – С. 104 – 112.
29. Овчинников Ю.Е., Шкловер В.Е., Стручков Ю.Т. и др. // Там же. – 1986. – **27**. – С. 134 – 141.
30. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B. et al. GAUSSIAN-98, Revision A.9 – Pittsburgh PA: Gaussian, Inc., 1998.
31. Dale J. // Acta Chem. Scand. – 1973. – **27**. – P. 1115 – 1129.